

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 3 月 8 日 (2007.3.8)

【公開番号】特開 2005-327509 (P2005-327509A)

【公開日】平成 17 年 11 月 24 日 (2005.11.24)

【年通号数】公開・登録公報 2005-046

【出願番号】特願 2004-142851 (P2004-142851)

【国際特許分類】

H 0 1 B 5/00 (2006.01)

H 0 1 B 1/22 (2006.01)

H 0 1 B 5/16 (2006.01)

H 0 1 R 11/01 (2006.01)

【F I】

H 0 1 B 5/00 C

H 0 1 B 1/22 A

H 0 1 B 1/22 B

H 0 1 B 1/22 D

H 0 1 B 5/16

H 0 1 R 11/01 5 0 1 C

H 0 1 R 11/01 5 0 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 1 月 24 日 (2007.1.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

架橋樹脂粒子の表面に導電性金属層が形成された導電性微粒子であって、下記式 (1) で表される導電性微粒子の荷重低下率が、30% 以下であることを特徴とする導電性微粒子。

$$\text{荷重低下率 (\%)} = \left(\left(\left(25 \text{ での測定荷重値} \right) - \left(180 \text{ での測定荷重値} \right) \right) / \left(25 \text{ での測定荷重値} \right) \right) \times 100 \quad \cdots (1)$$

但し、式中、測定荷重値は、導電性微粒子の塑性変形荷重値又は破壊荷重値を表す。